# 高輝度ビーム実現に向けた cERL入射器空洞の カプラーキックの評価

第15回 日本加速器学会年会 (THOM09) 〇布袋 貴大 (総合研究大学院大学) 宮島 司, 加藤龍好 (KEK)

背景

- 超伝導空洞は高電界で高平均電流ビームの加速が可能
- ビームが空洞に誘起する高調波(HOM)が問題

#### <u>HOMの対策方法</u>



HOMカプラー、入力カプラーによる電磁場の円筒対称分布からのズレが、軌道変動や非 対称な収束力などビームへ悪影響を及ぼす(カプラーキック)

### cERL入射器空洞での課題





推論

空洞に非対称な収束力を及ぼす原因があるのではないか?

### cERL入射器超伝導空洞

- ・ cERL入射器超伝導空洞: HOMカプラーを使用
  ▶ 低エネルギーでの輸送距離を短くするため
- HOMカプラー: ビーム入射側 -> Y字に3本 出口側 -> 水平に2本
  ▶ 空洞の円筒対称性は崩れている
- <u>入力カプラー</u>:上下に2本配置 -> 対称性あり



非対称な収束力はカプラーによる電磁場分布の 非対称性が原因ではないか?

## 研究目的

- 1. ビームプロファイルを楕円にする原因がカプラーキックであるこ とを示す
- 2. カプラーを含めたモデルを作成し、空洞内の電磁場分布を明らかにする
- 3. 個別のカプラーからの寄与を定量評価し、カプラーキックの主要 因を同定する

### CSTを用いた電磁場解析

・ 空洞内の電磁場分布を計算: CST固有モードソルバー
 1. カプラーなし
 2. 入力カプラーのみ





3. HOMカプラーのみ







- 4つのモデルを使用して解析を実施
  - 1. 中心軸上の分布比較(カプラーの電磁場への影響検証)
  - 2. 軸外での分布比較(対称性の検証)

### 1. 中心軸上の分布比較









4. 実機モデル(全カプラー付き)

2. 入力カプラーのみ





- 1. カプラーなし(円筒対称)
  *▶ z* 軸上に横方向の電場なし
- 2. 入力カプラーのみ
  ▶ z 軸上に横方向電場なし
  ◆上下の寄与が 打ち消されている
- ・ 3. HOMカプラーのみ
  > 横電場発生
  > 4. 実機モデルの分布に近い

HOMカプラーが中心軸上の電場を歪めている 7





x軸とy軸でE<sub>r</sub>が非対称である
 HOMカプラーによる電磁場分布の
 非対称性が収束力の非対称性の
 原因になり得る

次に、電磁場分布を基に、トラッキングで収束力を定量的に評価

8

シングルキック応答による収束力解析

トラッキング・実験で入射超伝導空洞による収束力を評価
 解析・測定条件

- ◆入射ビームのエネルギー: T = 500 keV (E = 1.1 MeV)
- ◆空洞通過後のエネルギー: E = 2.2 MeV (入射空洞1台のみで加速)
- ◆加速位相: 最大加速位相

#### <u>原理</u>

初期粒子をキック(軌道が変わる)
 ▶最終位置のキック量応答から収束力が分かる



数値的・実験的にkを求める

トラッキングによる収束力の計算結果



- 格子が縦長 -> 収束力が非対称
  > 収束力の強さ: 水平 > 垂直
- HOMカプラーのみでも、全部のカプラーを考慮した結果に近い
  >入カカプラーのみによる影響は小さい
- ビームプロファイルを歪める原因はカプラーキック
- cERL 2cell 空洞のカプラーキックの主要因はHOMカプラー

 $\frac{\sigma_y}{\sigma_x} = 1.3$ 

prizontal position [pixel]

#### 実験による収束力測定結果

実験は2段階で実施

1. RF off の結果からキック量を校正 (空洞内はドリフトスペースとなる)

2. 空洞1台で加速する条件で測定



- モデルは実際の電磁場分布をよく再現している
- 実際に空洞内の電磁場から非対称な収束力を受けている

![](_page_11_Figure_0.jpeg)

#### <u>実験結果</u>

- RF off: 対称
- RF on: 非対称

(水平収束力 > 垂直収束力)
 ▶ 実際に空洞内電磁場から、非対称な収束力を受けている
 > モデル計算と一致 -> モデルによる電磁場解析は妥当である

#### <u>モデルによる解析結果</u>

- 入力カプラーのみによる電磁場分布
  の非対称性への影響は小さい
- 主にHOMカプラーが電磁場分布の非 対称性を引き起こしている
   ▶ 非対称な収束力を与える原因
- ビーム移動量比とビームサイズ比が 一致
  - >プロファイル歪みの原因は空洞 からの非対称な収束力

![](_page_11_Figure_10.jpeg)

![](_page_11_Figure_11.jpeg)

![](_page_12_Picture_0.jpeg)

- CSTによって空洞内電磁場分布を再現し、数値的・実験的にcERL 2cell 超伝導空洞の カプラーキックの影響を定量評価した
- cERLで観測されていたビームプロファイルの歪みは、空洞内電磁場分布の非対称性が原因である
  - 電磁場分布の歪みはカプラーの存在に起因している
- cERL 2cell空洞のカプラー配置では、円筒対称モデルと比べ水平方向の収束力が強まり、垂直方向の収束力は弱まる
- 電磁場分布の非対称性を引き起こしている主要因はHOMカプラーである

#### <u>今後の課題</u>

- ・ カプラー1本ごとの影響を個別に解析
- 位相依存性の解析(有限バンチ長のビームへの影響)
- 横方向の非線形な影響の解析
- 3次元空洞モデルを使用した低エミッタンス輸送設計、ビーム制御